

『極限の光計測』

目次

1. 講演

- 「近接場光学を利用したSiウエハ加工表面のナノ欠陥計測」..... 1
東京大学 大学院 工学系研究科 高橋 哲 氏

2. 講演

- 「細胞機能解明のための新しい顕微鏡システム」..... 11
理化学研究所脳科学総合研究センター 先端技術開発グループ
細胞機能探索技術開発チーム
深野 天 氏、宮脇 敦史 氏

3. 研究発表

- 「赤外線サーモグラフィ法を用いた表面近傍の内部欠陥の検出」.. 23
香川大学 石井 明 氏、平田 英之
氏香川大学 大学院 杉山 博康
氏
(株)キャスコ 遠藤 雅文 氏

今回担当委員：高谷委員（阪大）、加藤委員（理化学研）、石井委員（香川大）、
野口委員（日立）